物理実験学 〜測定誤差と最小二乗法〜

伊藤さんの代理:奥村曉(CR研講師)

2019年12月13日





講義のスライド



https://www.isee.nagoya-u.ac.jp/~okumura/files/191213LeastSquare.pdf

これまでに出てきた統計用語の復習(1)

- □ 母集団:測定対象の数値や属性の集合全体
 - 例:鍋に入った味噌汁、日本人全体、超新星爆発から放出された全 てのニュートリノ
- 標本:実際に測定した値の集合(母集団の部分集合) 例:小さじ一杯の味見の味噌汁、無作為抽出の電話アンケート、カ ミオカンデで検出されたニュートリノ
- 母平均:母集団の平均 μ (真の平均)
- 標本平均:標本の平均 X (母平均の良い推定値)

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

これまでに出てきた統計用語の復習(2)

- 分散:値のばらつきの大きさの指標
- **母分散**:母集団の分散 σ²

** 標本分散:標本の分散 s²

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$$
 ※ 母平均を知らない場合 \bar{x} を使い $n-1$ で割る

"標準偏差:母分散や標本分散の平方根 σ もしくは s 次元が測定量と同じになる

サイコロの例

サイコロの目は 1~6 の整数値しかとらないので母平均は

$$\mu = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^{6} i = \frac{7}{2}$$

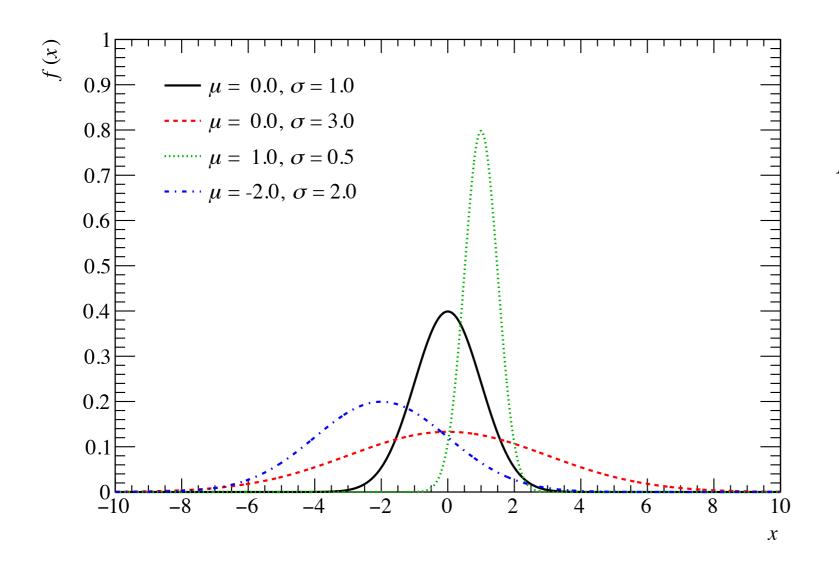
■ 母分散は

$$\sigma^2 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^{6} \left(i - \frac{7}{2} \right)^2 = \frac{35}{12}$$

፟ 標準偏差は

$$\sigma = \sqrt{\frac{35}{12}} \simeq 1.7$$

正規分布(ガウス分布)



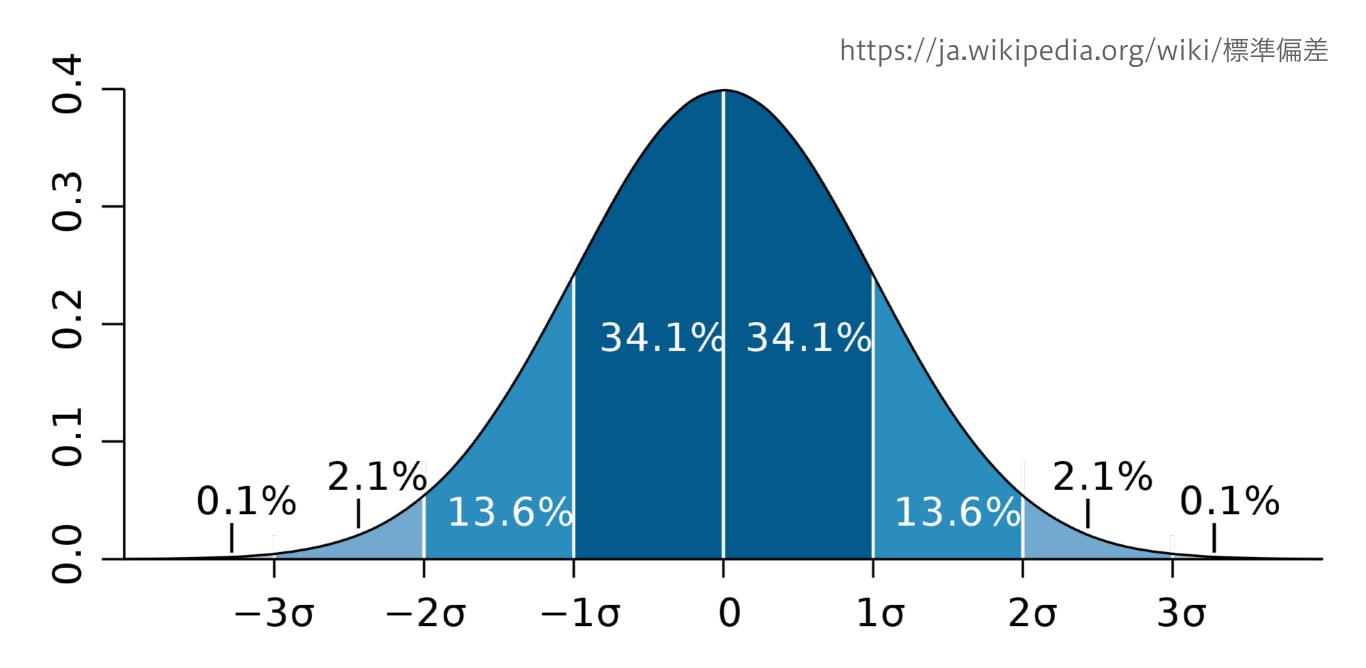
$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} P(x) = 1$$

興味のある人は実際に積分してみよ

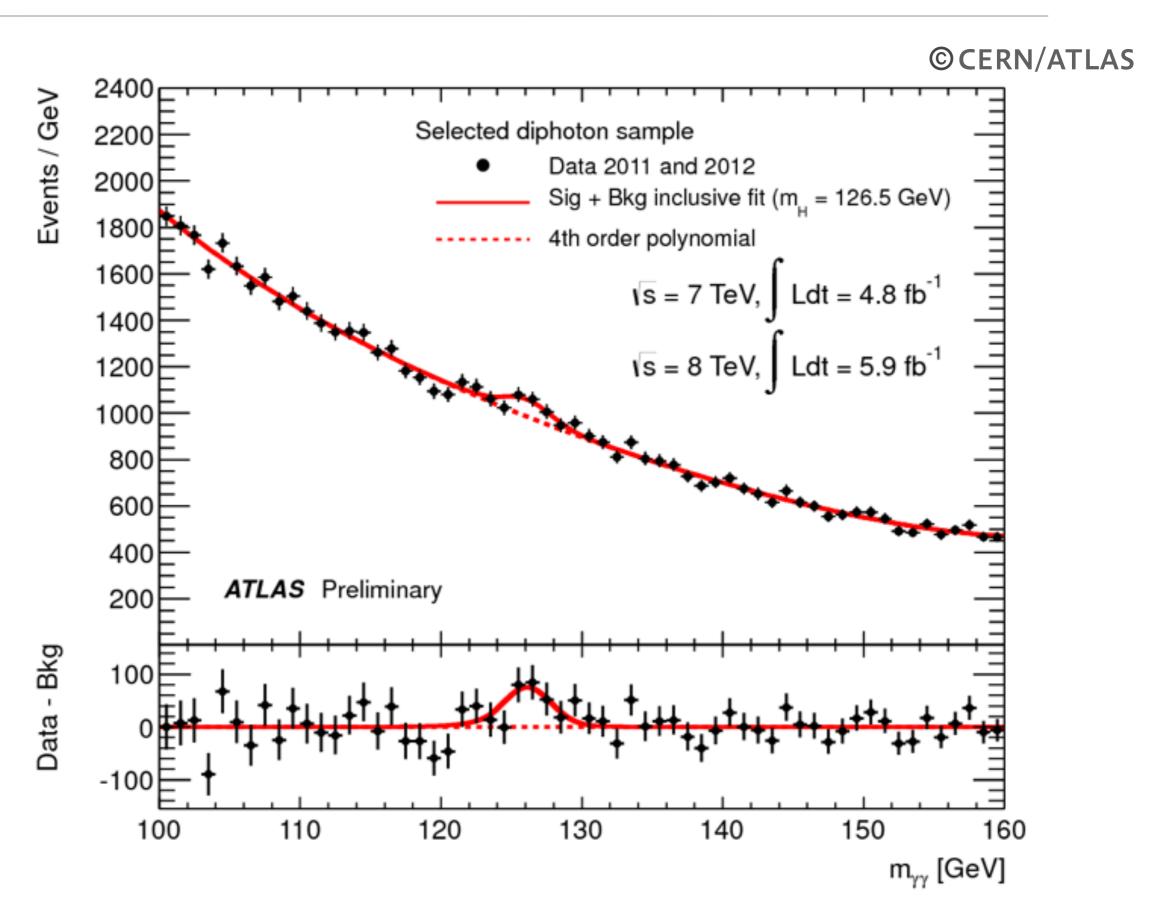
- 統計学や自然界の様々な場所で現れる確率分布
- 平均値 μ と標準偏差 σ の 2 変数で特徴付けられる

正規分布

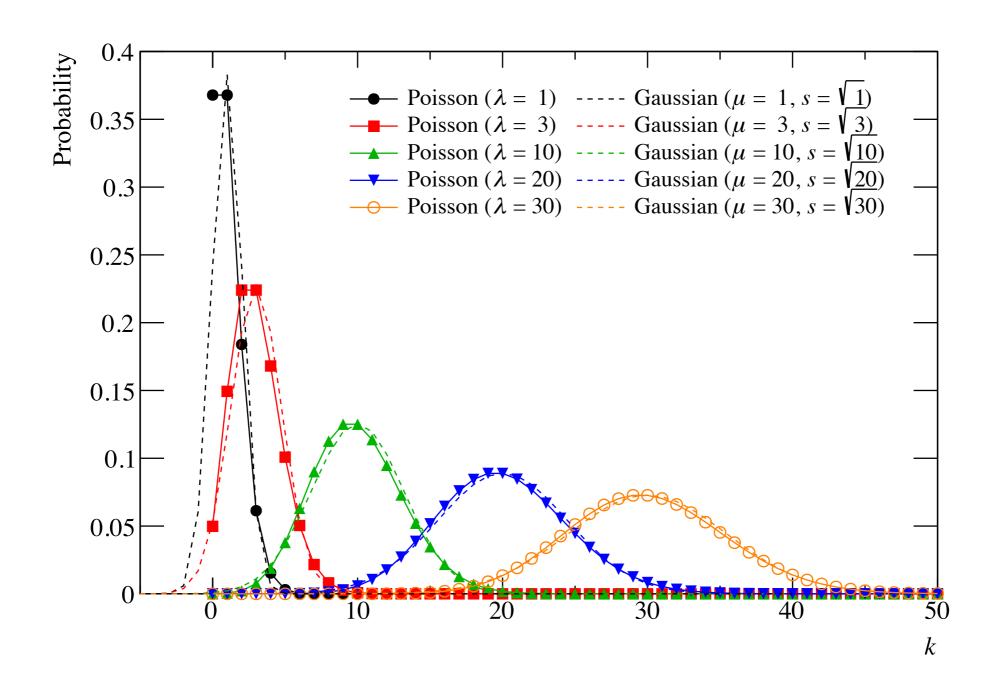


- **±** ±1σの範囲に 68.3% が収まる
- ****** 2σ 、 3σ の範囲だとそれぞれ 95.4%、99.7%
- **5** σ (素粒子物理学などで発見とされる) は 5.7 × 10-7 (サイコロで 1 が 8 回連続)

Higgs 発見の例

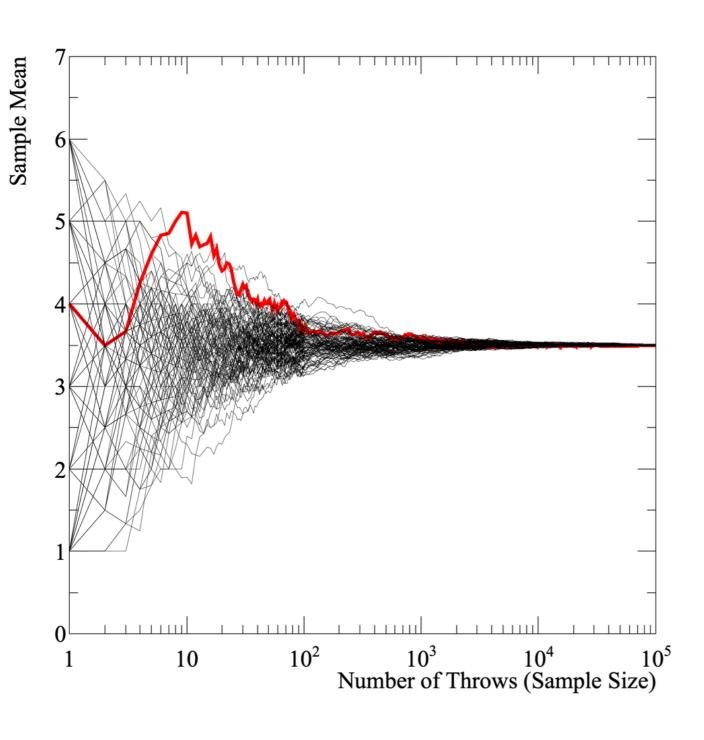


ポアソン分布と正規分布



■ ポアソン分布や二項分布(先日の赤玉と白玉の例)は、数が増えると正規 分布で近似できることが知られている

大数の法則



- 繰り返し行うことが可能で、かつ各試行が互いに影響を及ぼさない測定があるとき、その測定を多数回繰り返した際に得られる測定値の平均は、その測定の期待値に近づく
- 単純な例:サイコロを何回 も振ると、平均値は3.5 に 近づく

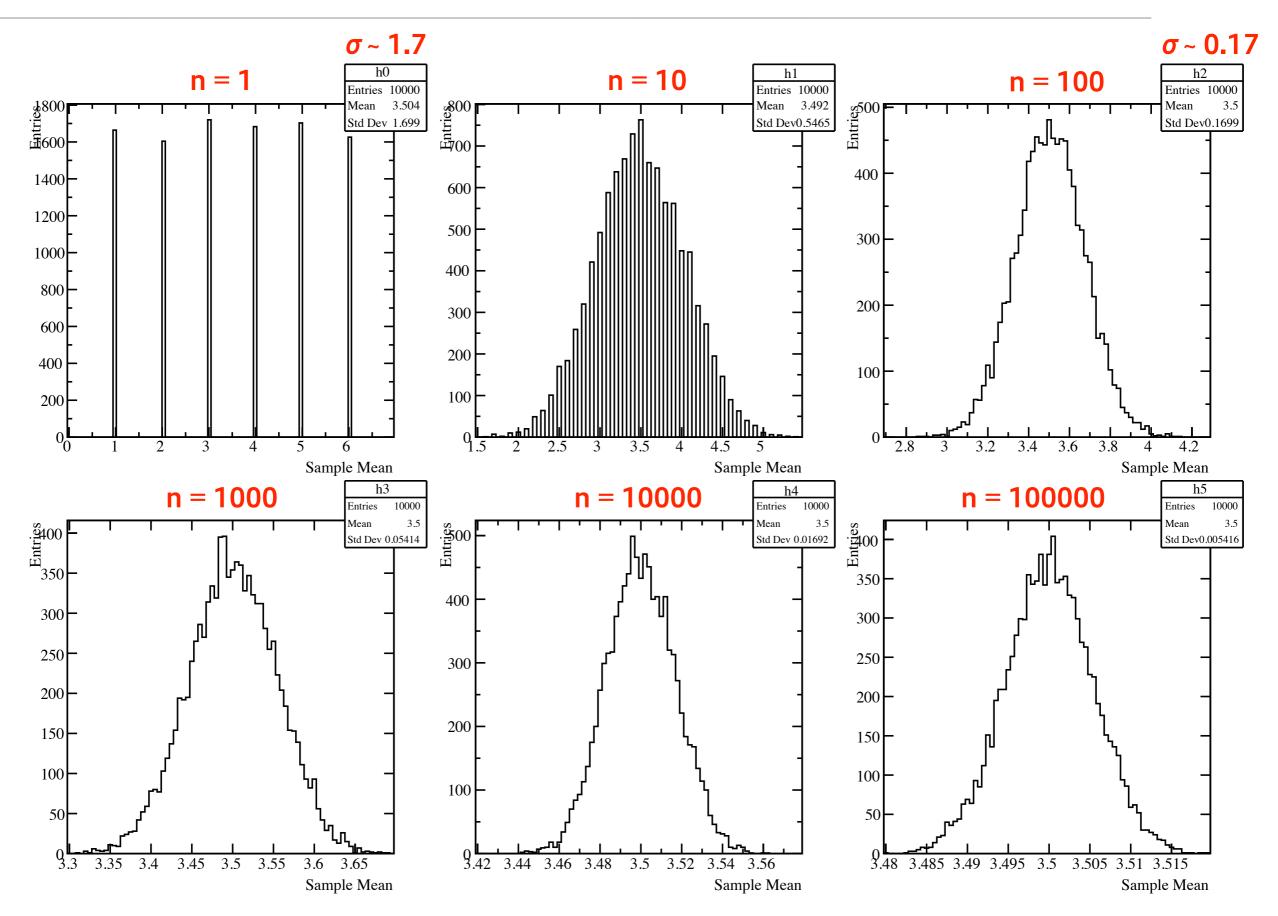
中心極限定理

・ (分散の定義できる) どのような確率分布の母集団 (平 均 μ、分散 σ) でも、標本サイズ n が十分大きくなると、 得られる標本平均 x は平均 μ、分散 σ²/n のガウス分布 に従う

■ つまり

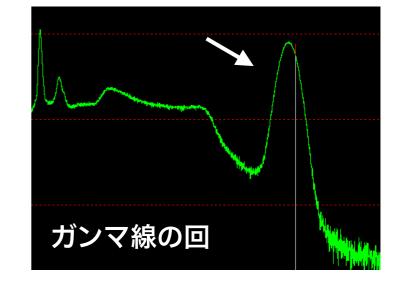
- 多数回の測定で平均値 x を算出すると、真の平均値 μ に近づく
- ト 平均値 \bar{x} の真の平均値 μ からのズレは、 σ/\sqrt{n} 程度である
- 測定回数が多いほど誤差は小さくなる

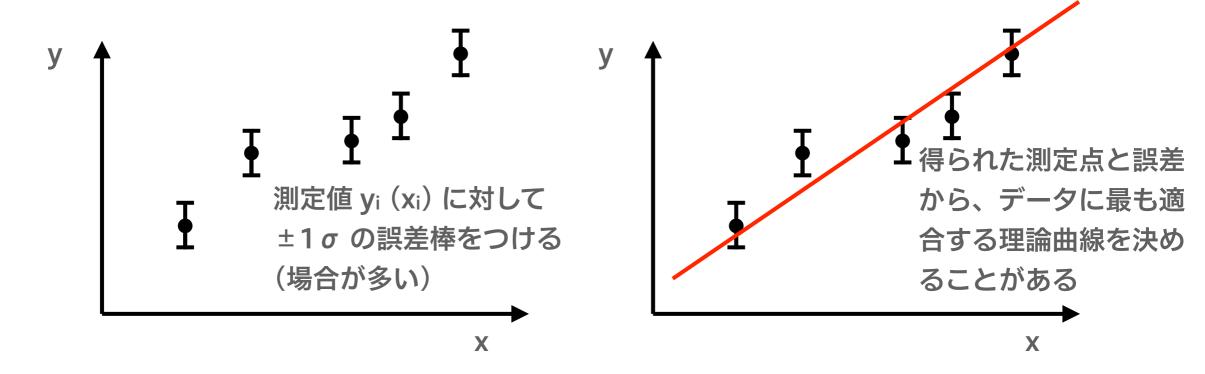
再びサイコロの例 (n回の平均値の10000回の分布)



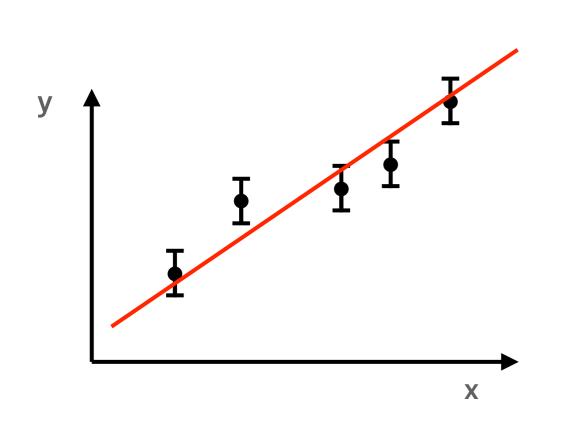
測定値の誤差

- 我々は、多くの場合に「真の値」を知らない
- 物理量の測定は、様々なランダムな確率過程を経る場合が多い
- 測定値の誤差が正規分布になる・近似できる場合が頻繁に現れる
 - ▶ 多数の電子の流れである電流値の測定
 - 放射線の検出回数(少数の場合はポアソン分布)
 - 光電子増倍管で検出した光子の個数





- 最も「尤もらしい」理論曲線を決定するやり方
- ** 簡単のため、測定点 y_i(x_i) の誤差が正規分布 (μ_i、 σ_i) に従うとする (一般的には好きな確率密度分布)



$$L = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \exp\left(-\frac{(y_i - f(x_i))^2}{2\sigma_i^2}\right)$$

ある理論曲線 f(x) を考えた場合、各xi に対して得られる測定値 yi の組み合わせは、xi における確率密度の積が大きいほど出やすいはずである

尤度 L を最大にする理論曲線が最も 尤もらしい(一般的に手計算は困難)

尤度 L を最大にする

L とを最大にする → ln L を最大にすれば良い

$$\ln L = \ln \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \exp\left(-\frac{(y_i - f(x_i))^2}{2\sigma_i^2}\right)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \left| \ln \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} - \frac{(y_i - f(x_i))^2}{2\sigma_i^2} \right|$$

$$=-\sum_{i=1}^n \frac{(y_i-f(x_i))^2}{2\sigma_i^2} + \text{const.}$$
 残差二乗和
$$\chi^2 \equiv \sum_{i=1}^n \frac{(y_i-f(x_i))^2}{\sigma_i^2}$$
 この項 $\chi^2/2$) を最小化すれば良い

$$\chi^2 \equiv \sum_{i=1}^n \frac{(y_i - f(x_i))^2}{\sigma_i^2}$$

最小二乗法

- さらに単純な場合を考える
 - xi の誤差は無視する
 - 誤差の大きさが各点で等しく、その真の値は不明
 - 理論曲線が f(x) = a + bx で表される

$$\ln L = -\sum_{i=1}^{n} \frac{(y_i - a - bx_i)^2}{2\sigma^2} + \text{const.}$$

$$= -\chi^2/2 + \text{const.}$$

したがって

$$\frac{\partial \chi^2}{\partial a} = 0 \qquad \frac{\partial \chi^2}{\partial b} = 0$$

を満たさなくてはいけない (χ^2) の最小値を探す)

ここから板書…